

Aanbesteding: Scanning Electron Microscope
Aanbestedende Dienst: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Referentie: 2022 FPL-INK 103

Toelichting:

De gestelde vragen en het antwoordt hierop heeft al eerder plaatsgevonden, namelijk op 14 maart.

Ref.nr. 2
Onderwerp: Preference 8.5.3.

Vraag:

Preference 8.5.3. The SEM system with a better lateral resolution than 0.7 nm referring to a standard e.g. Au on C at different kV (1, 2, 5, 10, 15 and 30kV)

There are several methods available to measure the resolution of the SEM. And the method used will have an impact on the resolution specifications. Which method should we therefor use?

Antwoord:

Gelieve uw vragen via de berichtenmodule met behulp van Appendix C01 in te dienen. Vragen visa de Vraag en Antwoord module worden niet in behandeling genomen.

Percelen: P1 Levering van een scanning electron microscope
Beantwoord op: 14-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 3
Onderwerp: Requirement 8.5.4.

Vraag:

Requirement 8.5.4. The SEM system must have a height resolution of 10 nm or better at different kV

What is meant with height resolution of de SEM?

Antwoord:

Geachte,

Ik verzoek u om uw vragen via de berichtenmodule in te dienen en daarbij gebruik te maken van Appendix C01.

Vragen die via de Vraag en antwoord-module worden ontvangen worden niet in behandeling genomen. Zie para 2.3 van de aanbestedingsleidraad.

Met vriendelijke groet,
Jurjen Bousma
Tactisch Inkloper
TNO

Percelen:	P1 Levering van een scanning electron microscope
Beantwoord op:	14-03-2023
Label:	Inhoud